12,13,05

Твердофазный синтез, структурные и магнитные свойства пленок CoPd

© В.Г. Мягков ¹, Л.Е. Быкова ¹, В.С. Жигалов ¹, И.А. Тамбасов ¹, Г.Н. Бондаренко ², А.А. Мацынин ¹, А.Н. Рыбакова ³

¹ Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН,

Красноярск, Россия

² Институт химии и химической технологии СО РАН,

Красноярск, Россия

³ Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева,

Красноярск, Россия

E-mail: miagkov@iph.krasn.ru

(Поступила в Редакцию 24 ноября 2014 г.)

Представлены результаты исследования структурных и магнитных свойств пленок CoPd эквиатомного состава, полученных путем отжига в вакууме поликристаллических Pd/Co и эпитаксиальных Pd/ α -Co(110) и Pd/ β -Co(001) двухслойных образцов. Показано, что для всех образцов при отжиге до 400°C не происходит перемешивания слоев и формирования соединений. Дальнейшее повышение температуры отжига приводит к образованию на интерфейсе Pd/Co неупорядоченной фазы CoPd, синтез которой полностью завершается после отжига при 650°. Определены эпитаксиальные соотношения между неупорядоченной фазой CoPd и подложкой MgO(001): CoPd(110) $\langle \bar{1}11 \rangle$ ||MgO(001) $\langle 100 \rangle$ и CoPd(001)[100]||MgO(001)[100], формирующиеся в пленках Pd/ α -Co(110) и Pd/ β -Co(001) соответственно. Расчеты первой константы магнитокристаллической анизотропии неупорядоченной фазы CoPd для образцов Pd/ α -Co(110) и Pd/ β -Co(001) дали близкие значения $K_1^{\text{CoPd}} = -(1.6 \pm 0.4) \cdot 10^5$ erg/cm³. Предложен возможный механизм твердофазного синтеза сплава CoPd.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-02-00948.

1. Введение

Мультислои с перпендикулярной магнитной анизотропией (ПМА) продолжают привлекать внимание и интенсивно исследоваться с целью практического применения в качестве сред для перпендикулярной записи информации [1,2], оперативных запоминающих устройств [3]. Мультислойные образцы Co/Pd имеют ПМА $\sim 8 \cdot 10^6 \, \text{erg/cm}^3$ [4], что несколько меньше, чем в материалах с большой одноосной магнитокристаллической анизотропией [5]. Экспериментальные наблюдения показывают, что нагрев до $\sim 400^{\circ} \text{C}$ не изменяет магнитные свойства мультислоев Со/Рd. Однако отжиг при температурах выше 400°C приводит к деградации ПМА, и направление легкого намагничивания укладывается в плоскость образца. Это интерпретируется в предположении, что нагрев является причиной перемешивания и сплавления на первоначально остром интерфейсе Pd/Co [6-10]. Химическое перемешивание на интерфейсе Co/Pd наблюдается в результате ионной имплантации [11] и интенсивного лазерного облучения, которые уменьшают ПМА [12,13]. Это согласуется с вычислениями электронной структуры, предсказывающими уменьшение ПМА при возникновении дефектов и сплавления на интерфейсе Co/Pd [14]. Согласно диаграмме фазового равновесия, в системе Co-Pd существует только разупорядоченный твердый раствор Со_хРd_{1-х} с постоянной решетки, изменяющейся в зависимости от состава от $a = 0.3826\,\mathrm{nm}$ для Pd до $a = 0.3544\,\mathrm{nm}$ для β -Со. Однако метастабильные упорядоченные фазы $L1_0$ -CoPd, $L1_2$ -CoPd $_3$ с температурами перехода порядок—беспорядок $\sim 830^{\circ}$ C были обнаружены в тонких пленках Co_x Pd $_{1-x}$ -сплавов, полученных вакуумным осаждением [10,15].

В настоящее время существует мало публикаций, посвященным условиям формирования неупорядоченных твердых растворов $\mathrm{Co}_x\mathrm{Pd}_{1-x}$, и отсутствуют данные об их магнитных свойствах как для массивных образцов, так и для тонких пленок. Важную информацию об условиях формирования и упорядочения фаз CoPd в процессе отжигов может дать изучение твердофазных реакций между тонкопленочными реагентами Co и Pd .

Хорошо известно, что твердофазные реакции в тонких пленках стартуют при некоторой температуре (температуре инициирования $T_{\rm in}$) с формированием только одной фазы, которая называется первой фазой [16–18]. Дальнейшее увеличение температуры ведет к появлению других фаз, которые образуют фазовую последовательность. До сих пор нет однозначного объяснения образования среди множества фаз данной бинарной системы первой фазы и фазовой последовательности, а также определения их температур инициирования, хотя и предложены некоторые модели [16–18].

В настоящей работе исследованы твердофазные реакции между пленкой Pd с поликристаллической пленкой Co, а также структур с гексагональным α -Co(110) и кубическим β -Co(001) эпитаксиальными слоями в процессе отжига в вакууме. Показано, что вне зависимости от структурной модификации и кристаллического состояния Co в образцах состава 1Co:1Pd с увеличением

температуры отжига выше 400° С начинается перемешивание слоев Со и Рd и формирование неупорядоченной фазы CoPd.

2. Методика экспериментов и приготовление образцов

Исходные поликристаллические Pd/Co и эпитаксиальные Pd/α -Co(110)/MgO(001), Pd/β -Co(001)/MgO(001) пленки были получены последовательным осаждением в вакууме слоев Со и Pd на стеклянные и MgO(001)-подложки соответственно. Перед осаждением подложки обезгаживались при 400°C в течение часа. В экспериментах использовались образцы с атомным сооотношением 1Co:1Pd (далее по тексту CoPd) общей толщиной 300 nm. Если осаждение слоя Со велось в вакуумной камере с давлением 10^{-6} mbar при температуре 250-300°C, то происходил эпитаксиальный рост α -Co(110) на MgO(001). Однако в вакууме 10^{-5} mbar при температуре подложки MgO(001)250-300°C преимущественно формировался эпитаксиальный кубический слой β -Co(001). Измерения магнитной анизотропии выполнены на вращательном магнитометре с максимальным магнитным полем 18 kOe. Рентгенофлуоресцентный анализ был использован для определения толщин слоев Со и Pd. Идентификация образующихся фаз была проведена на дифрактометре ДРОН-4-07 (Си K_{α} -излучение). Рентгенографические исследования эпитаксиальной ориентации фаз проведены на дифрактометре PANalytical X'Pert PRO с матричным твердотельным детектором PIXcel. Исходные образцы Pd/Co, Pd/α -Co(110)/MgO(001) и Pd/β -Co(001)/MgO(001) подвергались термическому отжигу в вакууме 10^{-6} mbar в температурном диапазоне от 250 до $650^{\circ}{\rm C}$ с шагом $50^{\circ}{\rm C}$ и выдержкой при каждой температуре 30 min. Все измерения проведены при комнатной температуре. Температурная зависимость сопротивления в процессе синтеза неупорядоченной фазы CoPd при нагреве поликристаллических пленок Pd/Co была измерена четырехзондовым методом с прижимными контактами в вакууме 10^{-6} mbar со скоростью нагрева ~ 5 градусов в минуту.

3. Экспериментальные результаты и их обсуждение

3.1. Твердофазный синтез сплава CoPd в поликристаллических пленках Pd/Co. Дифрактограммы исходных поликристаллических пленок Pd/Co, осажденных на стеклянные подложки, содержали отражения от Pd и α -Co, а также слабые пики от фаз β -Co (рис. 1, a), которые не изменялись при отжиге до 400°C (рис. 1, b). Из этого следует, что исходный слой Co содержал смесь кристаллитов низкотемпературной (α -Co) и высокотемпературной (β -Co) фаз. После отжига при 500°C отражения от Pd и Co исчезали и появлялись рефлексы с параметром решетки α = 0.372 nm, соответствующие твердому раствору Co₅₀Pd₅₀ (рис. 1, c). Это указывает на то, что перемешивание слоев Co и Pd

и синтез неупорядоченного сплава CoPd имеют температуру инициирования выше 400° С. На рис. 2 приведена зависимость электрического сопротивления исходных пленок Pd/Co от температуры нагрева. С увеличением температуры сопротивление монотонно растет, следуя металлическому ходу температурной зависимости сопротивления реагентов. Резкий рост сопротивления выше 400° С, несомненно, указывает на перемешивание слоев Co и Pd и синтез сплава CoPd с температурой инициирования $T_{\rm in} \sim 400^{\circ}$ С.

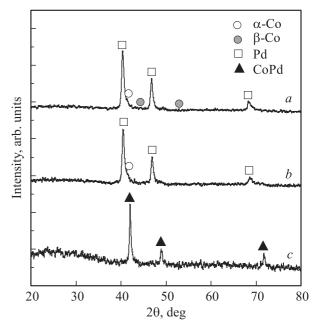


Рис. 1. Дифрактограммы поликристаллического пленочного образца Pd/Co при температурах отжига 20 (a), 400 (b) и 500°C (c).

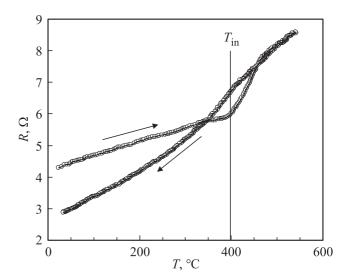
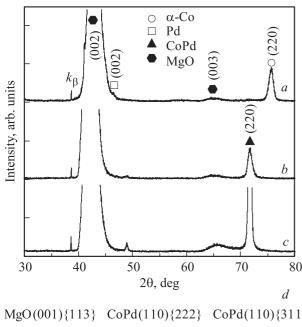


Рис. 2. Зависимость электрического сопротивления R(T) поликристаллического пленочного образца Pd/Co от температуры T. Стрелками показан прямой и обратный ход. Резкое увеличение R(T) начинается при температуре инициирования $T_{\rm in} = 400^{\circ}{\rm C}$ твердофазной реакции между пленками Pd и Co.



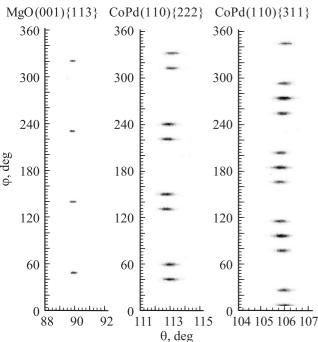


Рис. 3. Дифрактограммы пленок Pd/α -Co(110) при температурах отжига 20 (a), 500 (b) и $650^{\circ}C$ (c). d — асимметричное дифракционное изображение $(\varphi-2\theta)$ для подложки MgO(001) и пленок CoPd(110), полученных после отжига при $650^{\circ}C$. Эти сканы показывают эпитаксиальный рост $CoPd(110)\langle \bar{1}11\rangle \ \|MgO(001)\langle 100\rangle$.

3.2. Твердофазный синтез сплава СоРd в эпитаксиальных пленках Pd/α -Co(110). Исходные пленки Pd/α -Co(110) формировались путем осаждения при температуре $\sim 250^{\circ}$ С слоя Pd на поверхность α -Co(110)/MgO(001) в вакууме 10^{-6} mbar. На рис. 3, a показана дифракционная картина исходной пленки Pd/α -Co(110), формирующейся на поверхности MgO(001), которая содержит сильный α -Co(110)-пик и

слабое отражение от Pd (002). Это предполагает, что на поверхности α -Co(110) рос мелкодисперсный слой Pd. Анализ, проведенный в работе [19], показал, что кристаллиты α -Co(110) растут на MgO(001) в соответствии с двумя эпитаксиальными соотношениями

$$\alpha$$
-Co(110)[001] || MgO(001)[110],
 α -Co(110)[100] || MgO(001)[1 $\bar{1}$ 0]. (1)

Эти соотношения соблюдаются и при росте кристаллитов α -Co(110) на GaAs(001) [20] и в двухслойных Co/V-пленках на MgO(001), приготовленных в ультравысоком вакууме [21]. Энергия магнитной анизотропии E_K гексагонального кристалла (без учета анизотропии в базисной плоскости) имеет вид $E_K^{\alpha\text{-Co}} = K_1^{\alpha\text{-Co}} \sin^2 \varphi + K_2^{\alpha\text{-Co}} \sin^4 \varphi, \ldots$, где φ угол между осью \mathbf{c} и направлением намагниченности M_S [22]. Для α -Co константы магнитокристаллографической анизотропии равны $K_1^{\alpha\text{-Co}} = +4.3 \cdot 10^6 \, \mathrm{erg/cm}^3$, $K_2^{\alpha\text{-Co}} = +1.2 \cdot 10^6 \, \mathrm{erg/cm}^3$ [22].

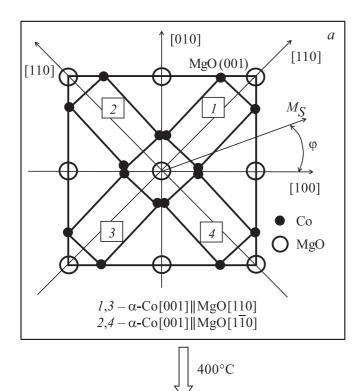
В предположении, что кристаллиты α -Co(110), растущие с ориентациями оси вдоль направлений [110] и [110] МдО и удовлетворяющие уравнению (1), обменно связаны и имеют равные объемы, их эффективная магнитная константа $K^{\alpha ext{-}\mathrm{Co}(110)}$ равна второй константе $K_2^{\alpha\text{-Co}}$ магнитокристаллографической анизотропии $\alpha\text{-Co}$ $(\tilde{K}^{\alpha\text{-CO}(110)} = K_2^{\alpha\text{-Co}})$ [20]. Совпадение экспериментальных значений $K^{\alpha\text{-Co}(110)}$ и $K_2^{\alpha\text{-Co}}$ подтверждает эпитаксиальный рост кристаллитов α -Co(110) на MgO(001) согласно эпитаксиальным соотношениям (1). Легкие оси пленок α -Co(110) совпадают с направлениями [110] и $[1\bar{1}0]$ подложки MgO(001). В системе координат, связанной с осями [100] и $[0\bar{1}0]$ подложки MgO(001), константа $K^{\alpha ext{-}\mathrm{Co}(110)}$ имеет отрицательное значение. На рис. 4, а приведено схематическое изображение кристаллитов α -Co(110), растущих на MgO(001) в соответствии с эпитаксиальными соотношениями (1).

Дифракционная картина исходных образцов Pd/α -Co(110) не менялась до 400° С. Отжиг при 500° С приводит к уменьшению α -Co(110)-пиков и началу формирования нового сильного (110)-пика фазы CoPd (рис. 3, b). С увеличением температуры отжига до 650° С отражение (110) сильно возрастает, что связано как с увеличением объема, так и с ростом кристаллического совершенства кристаллитов фазы CoPd(110) (рис. 3, c). Эпитаксиальное соотношение в плоскости между пленкой CoPd(110) и подложкой MgO(001)

$$CoPd(110)\langle \bar{1}11\rangle \parallel MgO(001)\langle 100\rangle \tag{2}$$

было определено измерением асимметричного φ -сканирования рефлексов {222}, {311} от фазы CoPd и {113} от подложки MgO (рис. 3, d).

На рис. 4, b приведено схематическое изображение четырех вариантов кристаллитов CoPd(110), синтезированных на поверхности MgO(001), после от-



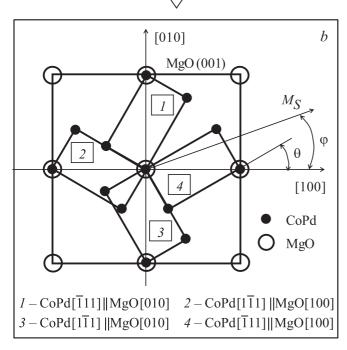


Рис. 4. Схематические диаграммы, показывающие структурную перестройку на поверхности MgO(001) исходных кристаллитов α -Co(110) (a) и кристаллитов после твердофазной реакции с Pd (b).

жига при 650° С, удовлетворяющих эпитаксиальному соотношению (2). Показано, что исходные криситаллиты α -Co(110), растущие на поверхности MgO(001) и удовлетворяющие эпитаксиальным соотношениям (1) (рис. 4,a), после реакции с Pd образуют кристал-

литы CoPd(110) с эпитаксиальным соотношением (2) (рис. 4, *b*).

3.3. Твердофазный синтез сплава CoPd в эпитаксиальных пленках Pd/β -Co(001). Формирование эпитаксиального слоя β -Co(001) осуществлялось осаждением кобальта на подложку MgO(001) при температуре $\sim 250^{\circ}$ C в вакууме 10^{-5} mbar. Ранее было показано, что метастабильная высокотемпературная кубическая фаза β -Co образуется при дан-

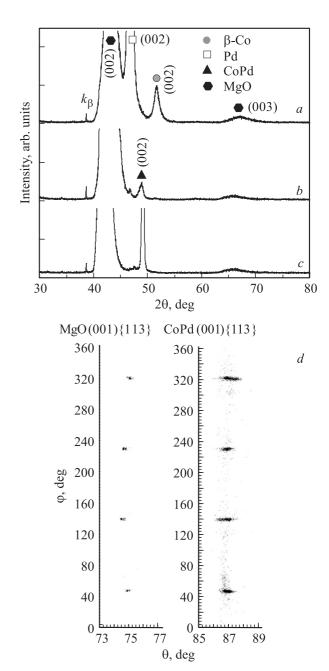
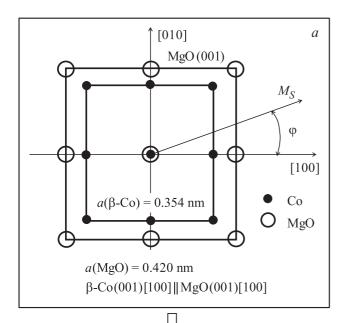


Рис. 5. Дифрактограммы пленок Pd/β -Co(001) при температурах отжига 20 (a), 500 (b) и 650° C (c). d — асимметричное дифракционное изображение ($\varphi-2\theta$) для подложки MgO(001) и пленок CoPd(001), полученных после отжига при 650° C. Эти сканы показывают эпитаксиальный рост CoPd(001)[100]||MgO(001)[100].



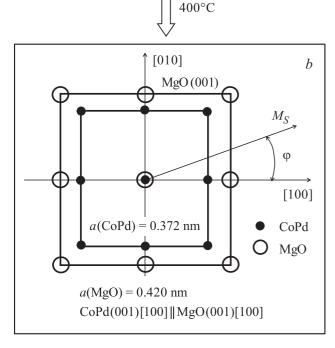


Рис. 6. Схематические диаграммы, показывающие структурную перестройку на поверхности MgO(001) исходных кристаллитов β -Co(001) (a) и криситаллитов после твердофазной реакции с Pd (b).

ных условиях осаждения [23] и в ультравысоком вакууме [24,25]. Пленки β -Со имели преимущественную (001)-ориентацию и двухосную магнитную анизотропию с константой, совпадающей с первой константой магнитокристаллографической анизотропии кубического кобальта $K_1^{\beta\text{-Co}(110)} = -(5.5-6.0) \cdot 10^5 \, \mathrm{erg/cm^3}$ [26–28]. Легкие оси намагничивания пленки β -Со совпадали с направлениями [110] и [1 $\bar{1}$ 0] подложки MgO(001), что подтверждает существование следующего ориентацион-

ного соотношения при эпитаксиальном росте кубического кобальта на поверхности MgO(001):

$$\beta$$
-Co(001)[100] || MgO(001)[100]. (3)

Осаждение слоя Pd осуществлялось при температуре $\sim 250^{\circ}$ C и не изменяло магнитные свойства слоя β -Co. Единственный Pd(002)-пик на дифракционной картине подтверждает последовательное преимущественное формирование эпитаксиальных слоев β -Co(001) и Pd(001) на поверхности MgO(001) (рис. 5, a). Схематическое изображение роста β -Co(001) кристаллитов на поверхности MgO(001), удовлетворяющих эпитаксиальному соотношению (3), приведено на рис. 6, a.

Дифракционная картина исходных образцов $Pd(001)/\beta$ -Co(001) не менялась до 400° С. После отжига при 500° С пики от Pd(002) и β -Co(002) сильно уменьшаются и образуются новые отражения (002) от фазы CoPd (рис. 5, b). С дальнейшим увеличением температуры отжига до 650°C отражения CoPd(002) сильно возрастали, а пики Pd(002) и β -Co(002) исчезали полностью (рис. 5, c). Это предполагает завершение синтеза кристаллитов CoPd(001), которые наследуют (001)ориентацию исходных пленок β -Co(001). Отсутствие сверхструктурного (001)-рефлекса подтверждает, что сформированная фаза CoPd является неупорядоченной. Путем асимметричного сканирования отражений {113} определено следующее эпитаксиальное соотношение для синтезированных кристаллитов СоРd(001) на подложке MgO(001) после отжига при 650° C (рис. 5, d):

$$CoPd(001)[100] \parallel MgO(001)[100],$$
 (4)

их схематическое изображение приведено на рис. 6, b. Такое же эпитаксиальное соотношение (4) образуют неупорядоченные фазы CoPd(001), полученные при различных условиях осаждения на подложки MgO(001) [29,30]. Из пика CoPd(002) определен параметр решетки фазы CoPd a=0.37135(4) nm, который близок к значению для CoPd-сплава массивных образцов.

3.4. Эволюция магнитокристаллографической анизотропии в эпитаксиальных пленках Pd/α -Co(110) и Pd/β -Co(001). Константы двухосной магнитной анизотропии в плоскости $K^{Pd/\alpha\text{-}Co(110)}$ и $K^{Pd/\beta\text{-}Co(001)}$ исходных пленок $Pd/\alpha\text{-}Co(110)$ и $Pd/\beta\text{-}Co(001)$, содержащих кристаллиты, которые представлены на рис. 4,a и 6,a, равны константам магнитокристаллографической анизотропии $K_2^{\alpha\text{-}Co}$ и $K_1^{\beta\text{-}Co}$ соответственно. На рис. 7 приведены зависимости эффективных констант магнитной анизотропии $K_{\text{eff}}^{A-Co} = K^{\text{Pd}/\alpha\text{-}Co(011)}/K_1^{\alpha\text{-}Co}$ от температуры отжига T для образцов $Pd/\alpha\text{-}Co(0110)$ и $Pd/\beta\text{-}Co(001)$ соответственно.

В пределах экспериментальной точности до температуры 400° С значения констант анизотропии $K_{\rm eff}^{110}(T)$ (рис. 7,a) и $K_{\rm eff}^{001}(T)$ (рис. 7,b) не зависели от температуры отжига T. При температурах отжига выше

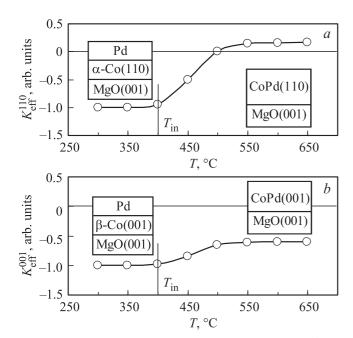


Рис. 7. Зависимости констант магнитной анизотропии $K_{\rm eff}^{110}$ (a) и $K_{\rm eff}^{001}$ (b) от температуры отжига T и схематические диаграммы для пленок ${\rm Pd}/\alpha\text{-Co}(110)$ и ${\rm Pd}/\beta\text{-Co}(001)$ соответственно. Изменения $K_{\rm eff}^{110}$, $K_{\rm eff}^{001}$ начинаются при температуре инициирования $T_{\rm in}\sim 400^{\circ}{\rm C}$ твердофазной реакции между пленками ${\rm Pd}$ и ${\rm Co}$ и заканчиваются при температуре $\sim 650^{\circ}{\rm C}$.

 400° С уменьшение абсолютных значений констант K_{eff}^{110} (рис. 7, a) и K_{eff}^{001} (рис. 7, b) в зависимости от температуры отжига T связано с началом перемешивания слоев Pd и Со и синтезом фазы СоРd. Это согласуется с данными по электрическому сопротивлению (рис. 2) и рентгеновской дифракции (рис. 1, 3, 5), из которых следует, что температура инициирования реакции палладия с кобальтом составляет $T_{in} \sim 400^{\circ} \text{C}$. Как показано выше, после отжига при 650°C реакция между Pd и Co заканчивается полностью и в пленках Pd/α-Co(110) формируется четыре варианта кристаллитов CoPd(110) (рис. 4, b), которые растут на поверхности MgO(001) и удовлетворяют эпитаксиальному соотношению (2). Известно также, что четыре варианта кристаллитов Fe(110) растут на Cu(001) в соответствии с эпитаксиальным соотношенем Питча $Fe(110)\langle \bar{1}11\rangle \|Cu(001)\langle 110\rangle \|31-37\|$. Плотность энергии магнитной анизотропии $E(\varphi)$ обменносвязаных кристаллитов CoPd(110), удовлетворяющих эпитаксиальному соотношению (2) описывается выражением, аналогичным полученному для кристаллитов Fe(110), находящихся в соотношении Питча [37]:

$$E(\varphi) = K^{\text{CoPd}(110)} \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi$$
$$= (3/4)K_1^{\text{CoPd}} \cos 4\theta \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi, \tag{5}$$

где ϕ — угол между намагниченностью M_S и направлением [100] MgO, θ — угол разориентации кристаллитов CoPd(110) относительно направлений [100]

и [010] MgO(001) (рис. 4, b). Из выражения (5) следует, что значение константы $K^{\mathrm{CoPd}(110)}$ двухосной магнито-кристаллической анизотропии кристаллитов CoPd(110), удовлетворяющих эпитаксиальному соотношению (2) (рис. 4, b), определяется значением первой константы K_{1}^{CoPd} магнитокристаллической анизотропии сплава CoPd

$$K^{\text{CoPd}(110)} = (3/4)K_1^{\text{CoPd}}\cos 4\theta.$$
 (6)

CoPd(110), кристаллитов удовлетворяющих эпитаксиальному соотношению (3), угол $\theta = 35.25^{\circ}$ (рис. 4, b). Подставляя в выражение (6) экспериментальное значение $K_{\rm eff}^{\rm Pd/\alpha\text{-}Co}(T=650^{\circ}{\rm C})=K^{\rm Co(110)}=+(1.0\pm0.4)\cdot 10^{5}~{\rm erg/cm}^{3}$ (рис. 7, a) и $\theta\cong35.25^{\circ}$ (рис. 4, b) и учитывая отношение объема пленки Pd к объему пленки Со (1:3), получим величину константы магнитокристаллографической анизотропии $K_1^{\mathrm{CoPd}} = -(1.6 \pm 0.4) \cdot 10^5 \, \mathrm{erg/cm^3}$ сплава СоР . Важно заметить, что, согласно выражению (6), константы $K^{\text{CoPd}(110)}$ и K_1^{CoPd} имеют разные знаки. Это соответствует смене знака в зависимости $K_{ ext{eff}}^{ ext{Pd}/\alpha ext{-Co}}(T)$ (рис. 7, a) при синтезе кристаллитов СоРd(110) в пленках Pd/α-Co(110). Значение константы $K_1^{
m CoPd} = -(1.6 \pm 0.4) \cdot 10^5 \, {
m erg/cm^3}$ хорошо согласуется $(T = 650^{\circ}\text{C})$ (рис. 7, b) для пленок CoPd(001). Таким образом, в пределах экспериментальной точности для эпитаксиальных пленочных систем CoPd (110) (рис. 4, b) и CoPd(001) (рис. 6, b) получена одинаковая оценка первой константы магнитокристаллографической анизотропии неупорядоченной фазы CoPd: $K_1^{\text{CoPd}} =$ $= -(1.6 \pm 0.4) \cdot 10^5 \, \mathrm{erg/cm^3}$. Однако эта величина более чем в 2 раза ниже значения для массивных образцов CoPd [38]. Причины значительной разницы в значениях K_1^{CoPd} остаются неясными.

В работах [39-53] было показано, что твердофазные реакции в двухслойных тонких пленках стартуют при минимальных температурах T_K структурного твердофазного превращения первой фазы $(T_{\rm in} = T_K)$, образующейся в продуктах реакции. Например, твердофазные реакции в пленках Pt/Co [39], Cu/Au [40], Pd/Fe [41] стартуют при температуре фазового перехода порядок-беспорядок в системах Pt-Co, Cu-Au, Pd-Fe, а в пленках Ni/Ti [42], Au/Cd [43], Al/Ni [44,45], Мп/Fe [46] — при температурах обратного мартенситного перехода A_s в системах Ni-Ti, Au-Cd, Al-Ni, Mn-Fe соответственно. Это правило выполняется и для других структурных превращений [47–53]. На основании этого можно предположить существование структурного фазового перехода при температуре $\sim 400^{\circ} \text{C}$ в районе эквиатомного состава системы Co-Pd. Этот переход может быть связан с существованием мартенситного перехода или превращения порядок-беспорядок в системе Co-Pd.

Известно, что в чистом Со и некоторых сплавах на основе Со, таких как Co-Ni, Co-Al, Co-Mn,

Со-Ge и Со-Си, происходят мартенситные превращения $\beta \leftrightarrow \alpha$ [54–57]. В чистом Со температура обратного мартенситного превращения $A_s = 429 - 445$ °C [54] близка к температуре инициирования $T_{\rm in}$ твердофазной реакции в поликристаллических Pd/Co и эпитаксиальных Pd/α -Co(110), Pd/β -Co(001) пленках. Это предполагает следующий сценарий синтеза фазы CoPd. При повышении температуры подложки T выше температуры обратного мартенситного перехода $A_s \sim 400^{\circ} \mathrm{C}$ на интерфейсе Pd/Co образуется аустенитная фаза CoPd, вследствие миграции атомов Pd в поликристаллический Со или эпитаксиальные слои β -Co(001) и α -Co(110). Однако уменьшение температуры подложки до температуры жидкого азота не приводит к переходу аустенитной фазы CoPd в мартенситную фазу CoPd. Это предполагает, что или мартенситное превращение подавлено в сплаве CoPd, или температура прямого мартенситного перехода $\beta \to \alpha A_s$ находится ниже -196°С. Например, в системе Со-Ni аустенитная фаза СоNi превращается в мартенситную фазу при охлаждении до температуры жидкого азота [54].

Твердофазный синтез сплава CoPd в пленках Pd/Co может также определяться переходом порядок—беспорядок в системе Co—Pd. Сверхструктура $L1_0$ не обнаружена в массивных образцах $\mathrm{Co}_x\mathrm{Pd}_{1-x}$. Однако в некоторых публикациях формирование $L1_0$ -сверхструктуры наблюдалось в пленках $\mathrm{Co/Pd}(111)$ при $560\,\mathrm{K}$ [10] и в пленках CoPd после отжига при $750^{\circ}\mathrm{C}$ [15]. Возможно, трудности экспериментального нахождения $L1_0$ -сверхструктуры связаны с крайне медленной кинетикой атомного упорядочения в сплаве CoPd.

Приведенные выше аргументы не дают однозначного ответа на вопрос о том, с каким твердофазным превращением связан синтез сплава CoPd в пленках Pd/Co после отжигов выше $\sim 400^{\circ}$ C. Однако, несомненно, появление химических взаимодействий между Со и Pd выше 400° C, приводящих к разрыву химических связей, перемешиванию слоев Со и Pd и синтезу фазы CoPd, указывает на существование структурного перехода в системе Co—Pd с температурой 400° C.

4. Заключение

Независимо от структурных модификаций кобальта твердофазная реакция между пленками Со и Рd начинается при температуре $T_{\rm in}=400^{\circ}{\rm C}$ и заканчивается полностью при температуре 650°C с образованием неупорядоченной фазы CoPd. Для двухслойных пленок Pd/ α -Co(110) и Pd/ β -Co(001) атомного состава 1Co:1Pd синтез сплава CoPd приводит к различному эпитаксиальному росту кристаллитов CoPd на подложке MgO(001): CoPd(110) $\langle\bar{1}11\rangle$ ||MgO(001) $\langle 100\rangle$ и CoPd(001)[100]||MgO(001)[100] соответственно. Для обеих эпитаксиальных пленочных систем получена одна и та же оценка первой константы магнитокристаллографической анизотропии неупорядоченной фазы CoPd:

 $K_1^{\text{CoPd}} = -(1.6 \pm 0.4) \cdot 10^5 \, \text{erg/cm}^3$. На основании анализа исследований взаимосвязи твердофазных реакций и превращений в пленочных структурах предполагается существование твердофазного превращения в системе Co-Pd с температурой $\sim 400^{\circ}\text{C}$.

Авторы благодарят Л.А. Соловьева за помощь в проведении рентгенографических исследований эпитаксиальной ориентации фаз в образцах Pd/α -Co(110) и Pd/β -Co(001).

Список литературы

- B.M. Lairson, W. Liu, A.P. Payne, C. Baldwin, H. Hamilton. J. Appl. Phys. 77, 6675 (1995).
- [2] B.D. Terris. J. Magn. Magn. Mater. 321, 512 (2009).
- [3] S. Mangin, D. Ravelosona, J.A. Katine, M.J. Carey, B.D. Terris, E.E. Fullerton. Nature Mater. 5, 210 (2006).
- [4] Z. Liu, R. Brandt, O. Hellwig, S. Florez, T. Thomson, B. Terris, H. Schmidt. J. Magn. Magn. Mater. 323, 1623 (2011).
- [5] D. Weller, A. Moser, L. Folks, M.E. Best, W. Lee, M.F. Toney, M. Schwickert, J.-U. Thiele, M.F. Doerner. IEEE Trans. Magn. 36, 10 (2000).
- [6] P.F. Carcia, A.D. Meinhaldt, A. Suna. Appl. Phys. Lett. 47, 178 (1985).
- [7] K. Yakushiji, T. Saruya, H. Kubota, A. Fukushima, T. Nagahama, S. Yuasa, K. Ando. Appl. Phys. Lett. 97, 232 508 (2010).
- [8] H. Yamane, Y. Maeno, M. Kobayashi. Appl. Phys. Lett. 62, 1562 (1993).
- [9] M. Gottwald, K. Lee, J.J. Kan, B. Ocker, J. Wrona, S. Tibus, J. Langer, S.H. Kang, E.E. Fullerton. Appl. Phys. Lett. 102, 052 405 (2013).
- [10] A. Murdoch, A.G. Trant, J. Gustafson, T.E. Jones, T.C.Q. Noakes, P. Bailey, C.J. Baddeley. Surf. Sci. 608, 212 (2013).
- [11] J. Carrey, A.E. Berkowitz, W.F. Egelhoff, D.J. Smith. Appl. Phys. Lett. 83, 5259 (2003).
- [12] L.F. Schelp, M. Carara, A.D.C. Viegas, M.A.Z. Vasconcellos, J.E. Schmidt. J. Appl. Phys. 75, 5262 (1994).
- [13] Ph.M. Leufke, S. Riedel, M.-S. Lee, J. Li, H. Rohrmann, Th. Eimüller, P. Leiderer, J. Boneberg, G. Schatz, M. Albrecht. J. Appl. Phys. 105, 113 915 (2009).
- [14] J.M. MacLaren, R.H. Victora. J. Appl. Phys. 76, 6069 (1994).
- [15] Y. Matsuo. J. Phys. Soc. Jn. 32, 972 (1972).
- [16] Thin films-interdiffusion and reaction / Eds J.M. Poate, K.N. Tu, J.W. Meyer. Willey-Intersciense, N.Y. (1978). 578 p.
- [17] R. Pretorius, C.C. Theron, A. Vantomme, J.W. Mayer. Crit. Rev. Solid .State Mater. Sci. 24, 1 (1999).
- [18] T. Laurila, J. Molarius. Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 28, 185 (2003).
- [19] Yu.V. Goryunov, M.G. Khusainov, I.A. Garifullin, F. Schreiber, J. Pelzl, Th. Zeidler, K. Bröhl, N. Metoki, H. Zabel. J. Magn. Magn. Mater. 138, 216 (1994).
- [20] E. Gu, M. Gester, R.J. Hicken, C. Daboo, M. Tselepi, S.J. Gray, J.A.C. Bland, L.M. Brown, T. Thomson, P.C. Riedi. Phys. Rev. B 52, 14704 (1995).
- [21] J.F. Calleja, Y. Huttel, M.C. Contreras, E. Navarro, B. Presa, R. Matarranz, A. Cebollada. J. Appl. Phys. 100, 053 917 (2006)
- [22] R.M. Bozorth. Phys. Pev. 96, 311 (1954).

- [23] H. Sato, R.S. Toth, R.W. Astrue. J. Appl. Phys. 34, 1062 (1963).
- [24] O. Benamara, E. Snoeck, T. Blon, M. Respaud. J. Cryst. Grown 312, 1636 (2010).
- [25] M.J.M. Pires, A.A.C. Cotta, M.D. Martins, A.M.A. Silva, W.A.A. Macedo. J. Magn. Magn. Mater. 323, 789 (2011).
- [26] J.A. Wolf, J.J. Krebs, G.A. Prinz. Appl. Phys. Lett. 65, 1057 (1994).
- [27] M. Hashimoto, H. Qiu, T. Ohbuchi, M. Adamik, H. Nakai, A. Barna, P.B. Barna. J. Cryst. Growth 166, 792 (1996).
- [28] T. Suzuki, D. Weller, C.-A. Chang, R. Savoy, T. Huang, B.A. Gurney, V. Speriosu. Appl. Phys. Lett. 64, 2736 (1994).
- [29] O. Yabuhara, M. Ohtake, K. Tobari, T. Nishiyama, F. Kirino, M. Futamoto. Thin Solid Films 519, 8359 (2011).
- [30] J.R. Childress, J.L. Duvail, S. Jasmin, A. Barthélémy, A. Fert, A. Schuhl, O. Durand, P. Galtier. J. Appl. Phys. 75, 6412 (1994).
- [31] M. Wuttig, B. Feldmann, J. Thomassen, F. May, H. Zillgen, A. Brodde, H. Hannemann, H. Neddermeyer. Surf. Sci. 291, 14 (1993).
- [32] P. Schmailzl, K. Schmidt, P. Bayer, R. Döll, K. Heinz. Surf. Sci. 312, 73 (1994).
- [33] R. Naik, C. Kota, J.S. Payson, G.L. Dunifer. Phys. Rev. B 48, 1008 (1993).
- [34] F. Scheurer, R. Allenspach, P. Xhonneux, E. Courtens. Phys. Rev. B 48, 9890 (1993).
- [35] T. Bernhard, M. Baron, M. Gruyters, H. Winter. Surf. Sci. 600, 1877 (2006).
- [36] J. Shen, C. Schmidthals, J. Woltersdorf, J. Kirschner. Surf. Sci. 407, 90 (1998).
- [37] V.G. Myagkov, L.E. Bykova, L.A. Solovyov. J. Magn. Magn. Mater. 322, 1715 (2010).
- [38] N. Miyata, M. Hagiwara, Y. Ichiyanagi, K. Kuwahara, H. Matsufuji. J. Phys. Soc. Jpn. 55, 961 (1986).
- [39] В.Г. Мягков, Л.А. Ли, Л.Е. Быкова, И.А. Турпанов, П.Д. Ким, Г.В. Бондаренко, Г.Н. Бондаренко. ФТТ **42**, *5*, 937 (2000).
- [40] В.Г. Мягков, Л.Е. Быкова, В.С. Жигалов, А.И. Польский, Ф.В. Мягков. Письма в ЖЭТФ 71, 5, 268 (2000).
- [41] В.Г. Мягков, В.С. Жигалов, Л.Е. Быкова, Л.А. Соловьёв, Г.Н. Бондаренко. Письма в ЖЭТФ **91**, *9*, 481 (2010).
- [42] В.Г. Мягков, Л.Е. Быкова, Л.А. Ли, И.А. Турпанов, Г.Н. Бондаренко. ДАН **382**, *4*, 463 (2002).
- [43] В.Г. Мягков, Л.Е. Быкова, Г.Н. Бондаренко. ДАН **388**, *1*, 844 (2003).
- [44] В.Г. Мягков, Л.Е. Быкова. ДАН 396, 2, 187 (2004).
- [45] V.G. Myagkov, L.E. Bykova, S.M. Zharkov, G.V. Bondarenko. Solid State Phenom. **138**, 377 (2008).
- [46] В.С. Жигалов, В.Г. Мягков, О.А. Баюков, Л.Е. Быкова, Г.Н. Бондаренко, А.А. Мацынин. Письма в ЖЭТФ **89**, *2*, 725 (2009).
- [47] В.Г. Мягков, Л.Е. Быкова, Г.Н. Бондаренко. ДАН **390**, *1*, 35 (2003).
- [48] V.G. Myagkov, V.C. Zhigalov, L.E. Bykova, G.N. Bondarenko. J. Magn. Magn. Mater. **305**, 334 (2006).
- [49] V.G. Myagkov, V.C. Zhigalov, L.E. Bykova, G.V. Bondarenko, G.N. Bondarenko, J. Magn. Magn. Mater. 310, 126 (2007).
- [50] В.С. Жигалов, В.Г. Мягков, Л.А. Соловьев, Г.Н. Бондаренко, Л.Е. Быкова. Письма в ЖЭТФ 88, 6, 445 (2008).
- [51] В.Г. Мягков, Л.Е. Быкова, Г.Н. Бондаренко, В.С. Жигалов. Письма в ЖЭТФ **88**, *8*, 591 (2008).

- [52] V.G. Myagkov, O.A. Baykov, L.E. Bykova, G.N. Bondarenko. J. Magn. Magn. Mater. 321, 2260 (2009).
- [53] В.Г. Мягков, В.С. Жигалов, А.А. Мацынин, Л.Е. Быкова, Г.В. Бондаренко, Г.Н. Бондаренко, Г.С. Патрин, Д.А. Великанов. Письма в ЖЭТФ 96, 1, 42 (2012).
- [54] H. Yang, Y. Liu. Acta Mater. 54, 4895 (2006).
- [55] T. Omori, Y. Sutou, K. Oikawa, R. Kainuma, K. Ishida. Mater. Trans. 44, 2732 (2003).
- [56] W. Zhou, Y. Liu, B. Jiang, P. Zhou. Mater. Sci. Eng. A 438–440, 468 (2006).
- [57] T. Nishizawa, K. Ishida. Bull. Alloy Phase Diagram 4, 387 (1983).